

■仕様

	手動ステージ	自動ステージ
テーブルサイズ (mm)	170 × 110	240 × 220
移動量 X (mm)	70	200
移動量 Y (mm)	70	200
移動量 Z (mm)	80	50
測定物の高さ(最大) (mm)	80 (オプション150)	50
本体寸法 (mm)	600(W) × 465(D) × 754(H)	
重量 (Kg)	79	85
サンプル荷重 (Kg)	3	1

X線源(標準)	油浸式小型微小焦点X線管 / ターゲット: タングステン / 管電圧: 50kV / 管電流: 最大 1.2mA
コリメータ	5種類(自動切換式) / 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0φ mm / (オプション) 0.05 × 0.5, 0.05φ
照射方式	上面垂直照射方式
検出器	比例計数管
資料観察	CCDカラーカメラ
フィルタ	2種類 (Co, Ni) 自動切換
測定対象	原子番号22(Ti)~83(Bi) / 原子番号21以下は吸収法にて測定可能
測定可能範囲	原子番号22~24: 0.02~約20μm / 原子番号25~40: 0.02~約30μm 原子番号41~51: 0.02~約70μm / 原子番号52~83: 0.01~約10μm
検量線	検量線自動作成機能 / マルチポイント検量線
補正機能	ベース補正
アプリケーション	単層めっき測定 / 2層めっき測定 / 3層めっき測定 / 合金膜厚成分比同時測定 無電解ニッケル測定
測定機能(共通)	自動測定 / 出力様式設定 / 自動測定条件設定 / スペクトル測定 / 2点間距離測定
自動ステージ機能	測定位置指定(X-Y-Z) / 同一パターン繰り返し機能 / 原点補正機能 測定位置確認機能 / 自動校正
データ処理	統計量表示: 平均、標準偏差、最大、最小、レンジ、Cp、Cpk / ヒストグラム プロファイル表示 / 測定データ3次元表示 / ρ-R管理図
安全機能	X線電源キースイッチ / フェールセーフ機能
その他の機能	ステージ座標表示 / 装置保守整備

仕様、外観等は改良のため予告なく変更することがあります。

届出 使用にあたって所轄の労働基準監督署への届出が必要です。

■徹底したサポート&アフターフォロー

電測では、導入いただいた機器のアフターフォローを徹底しています。納入させていただいた機器は生涯動く限り、メンテナンスを実施いたします。お客様が導入後も安心して利用いただけるよう取り組んでいます。

【日本全国への出張フォロー】

蛍光X線式膜厚計をご利用のお客様には、定期校正・修理といったアフターフォローサービスを日本全国で行います。定期点検等の時期を事前に登録いただけましたら、弊社よりご案内し、出張フォローいたします。

<販売元>



〒164-0011 東京都中野区中央2丁目31番5号
TEL (03)3365-4411 FAX(03)3371-1287
営業時間 09:00~18:00 定休日 土・日・祝



株式会社サンコウ電子研究所

東京営業所: 〒101-0047 東京都千代田区内神田2-6-4 柴田ビル2F
TEL (03)3254-5031 FAX (03)3254-5038
大阪営業所: 〒530-0044 大阪市北区東天満1-11-9 和氣ビル2F
TEL (06)6881-1230 FAX (06)6881-1232
仙台営業所: 〒983-0868 仙台市宮城野区鉄砲町中2-5 ポスル・エスト1F
TEL (022)292-7030 FAX (022)292-7033
名古屋営業所: 〒462-0847 名古屋市北区金城3-11-27 名北ビル
TEL (052)915-2650 FAX (052)915-7238
福岡営業所: 〒812-0023 福岡市博多区奈良屋町11-11
TEL (092)282-6801 FAX (092)282-6803
本社・生産技術センター: 川崎

蛍光X線式膜厚計

EX-731

X-ray Fluorescence
Coating Thickness Tester



 株式会社電測
DENSOKU INSTRUMENTS CO.,LTD.

蛍光X線式膜厚計

EX-731

ダブルフィルタ採用

ニューメリックフィルタの他に、メカニカルフィルタ(ダブルフィルタ)の採用で、常に最高の精度が得られるように最適の条件で測定できます。

報告書作成機能が充実

Windowsソフト採用により、簡単に測定画面を取り込み、報告書作成機能が充実。マルチタスク機能で測定中でもレポート作成を含む他処理が可能です。

コリメータ5種類内蔵

コリメータの最小が0.1φmmで極微小部の測定が可能。標準・0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0 更にオプション0.05φmmのコリメータを用意しました。

スリット付きカバー

本体カバーにスリットが付いているので、長い測定物でも切らずに測定できます。

■非ニューメリック法による皮膜/下地の測定条件表

Cr:クロム Ni:ニッケル Cu:銅 Zn 亜鉛 Ag:銀 Sn スズ Au:金 Fe:鉄 Pb:鉛 Sn-Pb:はんだ(Sn,Pb合金) BRS:真鍮(CuZn合金)

測定物組合せ		測定可能条件 [μm]
皮膜	下地	
Cr	Fe	0.02~20
	Ni	
	Cu,Zn,BRS等	
Ni Ni-P	Fe	0.02~30
	Cu	
	BRS	
Cu	Fe	0.02~30
	Zn,BRS	
Zn	Fe	0.02~45
	Cu	
Ag	Fe,Cu,Zn,BRS等	0.02~50
Sn	Fe,Cu,Zn,BRS等	0.05~90
Au	Ni	0.01~8.0
	Cu	
Sn-Pb合金	Cu,Ni	0.1~50(Pb:10%)※1
Cr/Ni	Fe	Cr:0.01~5.0 / Ni:0.1~20
	Cu	
	BRS	

測定物組合せ		測定可能条件 [μm]
皮膜	下地	
Ni/Cu	Fe	Ni:0.02~20 / Cu:0.1~20
Ag/Ni	Cu	Ag:0.02~5.0 / Ni:0.1~20
	Fe	
Ag/Cu	BRS	Ag:0.02~5.0 / Cu:0.1~20
	Fe	
Sn/Ni	Cu	Sn:0.05~4.0 / Ni:0.1~20
	Fe	
Sn/Cu	BRS	Sn:0.05~4.0 / Cu:0.1~20
	Fe	
Au/Ni	Cu	Au:0.01~2.0 / Ni:0.1~20
	BRS	
	Fe	
Au/Ag	Cu	Au:0.01~2.0 / Ag:0.02~5.0
	Ni	
Ni-Zn合金	Fe	---

※1 合金比率により変わります。

自動測定ステージ

自動ステージタイプでは次のような機能を利用できます。

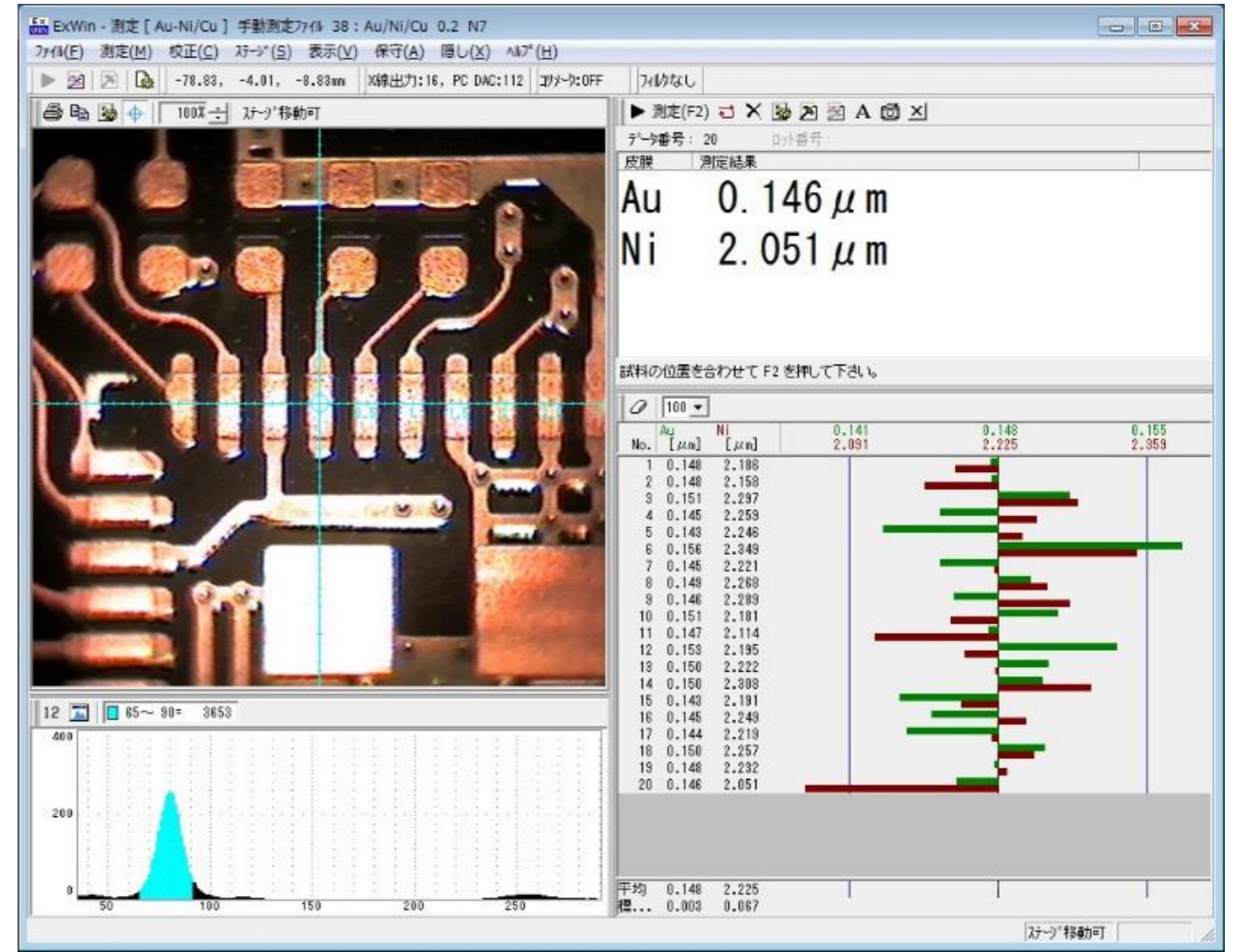
- ・連続自動測定
- ・全自動校正
- ・マウスクリックによる位置合わせ
- ・面内分布測定
- ・2点間の距離測定

測定部モニタ画面表示

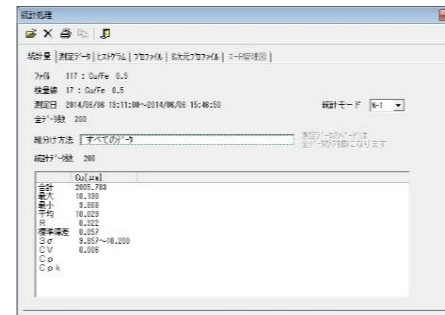
X線照射部をWindows画面に取り込み、X線照射部を表示。コリメータによって、大きさが変わる倍率変更機能を実現。

測定物のめっき付着分布をビジュアル表示

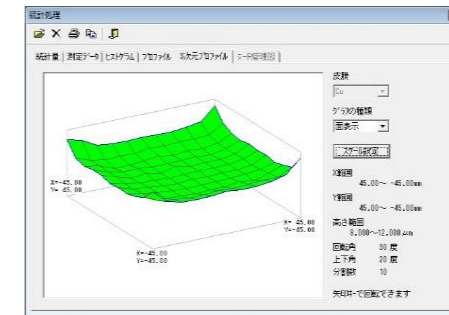
3次元グラフ表示により測定物のめっき厚分布が一目で確認できます。



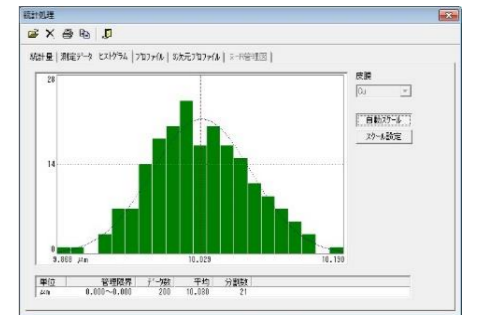
●測定時の画面



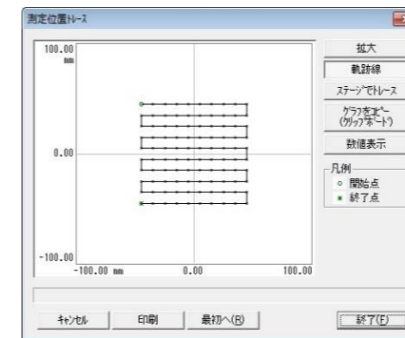
●統計量表示



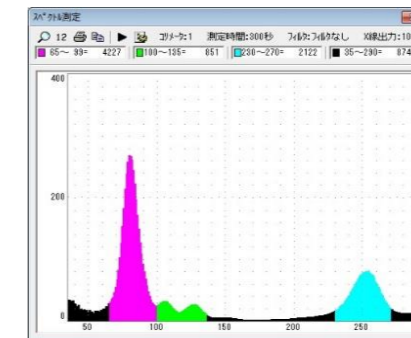
●3次元グラフ



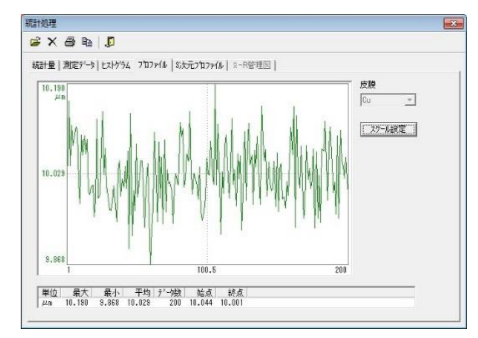
●ヒストグラム



●自動測定位置確認



●スペクトル測定



●プロファイル